

Шеремет Евгения Сергеевна

PhD (доктор наук в области экспериментальной физики, технический университет г. Хемница, Германия).

Индекс Хирша: 8

Родилась в 1988 г. в г. Новосибирске.



2009 – Степень бакалавра в области нанотехнологий (с отличием), Новосибирский государственный технический университет.

2010 – Переводчик с английского языка, Новосибирский государственный технический университет;

2011 – Магистр в области нанотехнологий (с отличием), Новосибирский государственный технический университет;

2015 – PhD, технологический университет г. Хемница, Германия;

2014 – 2017 – Постдок, технологический университет г. Хемница, Германия;

Учебная работа:

2014 – 2017 - Преподавание курса по композиционным материалам (технологический университет г. Хемница, Германия);

2012 – 2017 – Приглашенный лектор в Университете Калабрия (Козенца, Италия), Наношкола, (Вильнюс, Литва), университет г. Линца (Линц, Австрия).

Июль 2017 г. – профессор кафедры лазерной и световой техники Института физики высоких технологий ТПУ.

Научные достижения:

После получения степени магистра в области нанотехнологий в Новосибирске (Россия), провела шесть лет в Хемнице (Германия), работая в области новейших разработок, связанных с наноспектроскопией.

Организовала международную сеть сотрудников, что отражено в совместных публикациях. Активный член European COST Action MP1302 “Nanospectroscopy” <http://www.cost-nanospectroscopy.eu/>.

Один из основателей команды команды TERS-team и один из ее лидеров, внесла свой вклад в достижения команды в качестве самой продуктивной научной единицы Института физики в технологическом университете г. Хемница (www.ters-team.com).



Результаты исследовательской работы были представлены в более 30 рецензируемых публикациях на международных конференциях и семинарах в Европе, Америке и Азии. Выступления в качестве приглашенного докладчика на международных конференциях, обладатель международных наград.

Темы научных работ:

- исследования усиления оптических сигналов с помощью плазмонов в tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS): разработка установки для TERS, характеристика органических и неорганических полупроводников с помощью TERS, оптимизация производительности с помощью численного моделирования и аналитических расчетов;
- Кельвин зондовая силовая микроскопия (KPFM): инновационное применение для характеристики напряжения в кремниевых приборах.